

**Изменение № 3 ГОСТ 12228.1—78 Рутений. Метод спектрального анализа**  
**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 04.10.96)**

**Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2252**

**Дата введения 1997—09—01**

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

*(Продолжение см. с. 18)*

*(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 12228.1—78)*

Вводная часть. Первый абзац после слова «свинца» дополнить словами: «титана, осмия, олова»;

второй абзац. Заменить слова: «переменного тока» на «переменного и постоянного токов».

Раздел 2. Второй абзац. Заменить слова: «переменного тока» на «переменного и постоянного токов»;

одиннадцатый абзац изложить в новой редакции: «Фотопластинки spectroграфического типа ЭС чувствительностью 5 — 10 ед. или другие контрастные фотоматериалы».

Пункт 3.1. Второй абзац. Исключить слова: «и тщательно растирают с 200 мг графитового порошка в течение 30 мин».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1. Спектры градуировочных образцов и проб фотографируют на spectroграфе при следующих условиях: ширина щели 0,015 мм, освещение щели трехлинзовым конденсором, сила постоянного тока 10 А, экспозиция 60 с. Межэлектродное расстояние 2,5 мм устанавливают и поддерживают постоянным в течение экспонирования спектров по изображению на промежуточной диафрагме. Электрод с анализируемой пробой является анодом. При определении примесей, массовая доля которых: Pt, Fe, Ti — более 0,01 %; Pd, Mg, Si — более 0,003 %; Rh, Ni, Pb, Au, Sn — более 0,005 %; Ag, Cu, Al — более 0,001 %; Iг — более 0,025 % от аналитической пробы отбирают навеску в 100 мг и тщательно растирают с 200 мг графитового порошка в течение 30 мин. Спектры градуировочных

*(Продолжение см. с. 19)*

образцов и проб фотографируют в дуге переменного тока силой 7 — 8 А, экспозиция 90 с. Для определения бария спектры градуировочных образцов и проб фотографируют при силе тока 7 А, экспозиция 45 с. Для определения осмия от аналитической пробы отбирают навеску 400 мг и тщательно перемешивают с 400 мг окиси меди (CuO) в течение 30 мин. Спектры градуировочных образцов и проб фотографируют в дуге переменного тока силы 8 — 10 А, экспозиция 90 с. Спектры фотографируют на высококонтрастные фотоматериалы (пластинки, пленку). Фотопластинки (фотопленки) проявляют в течение 5 мин при температуре проявителя 20 °С. Проявленные фотопластинки и фотопленки ополаскивают в воде, фиксируют, промывают в проточной воде, высушивают и фотометрируют.

Пункт 5.1. Таблица 1. Головка таблицы. Графа «Длина волны, нм». Заменить

*(Продолжение см. с. 20)*

---

слова: «Аналитической линии» на «аналитической линии»; «Внутреннего стандарта» на «линии «внутреннего стандарта»;  
дополнить новыми элементами с соответствующими длинами волны:

Определяемый элемент	Длина волны, нм	
	аналитической линии	линии «внутреннего стандарта»
Титан	307,86	307,66
Осмий	315,63	315,07
Олово	326,23	326,65

(ИУС № 5 1997 г.)